



Kurzbeschreibung

Die elektrische Impulsfeldquelle ICI E450 L-EFT koppelt schnelle Einschwingimpulse in einen Test-IC (offener Chip). Dies ermöglicht eine Fehlerinduktion (fault injection) oder das Testen der Immunität einzelner Bereiche des IC.

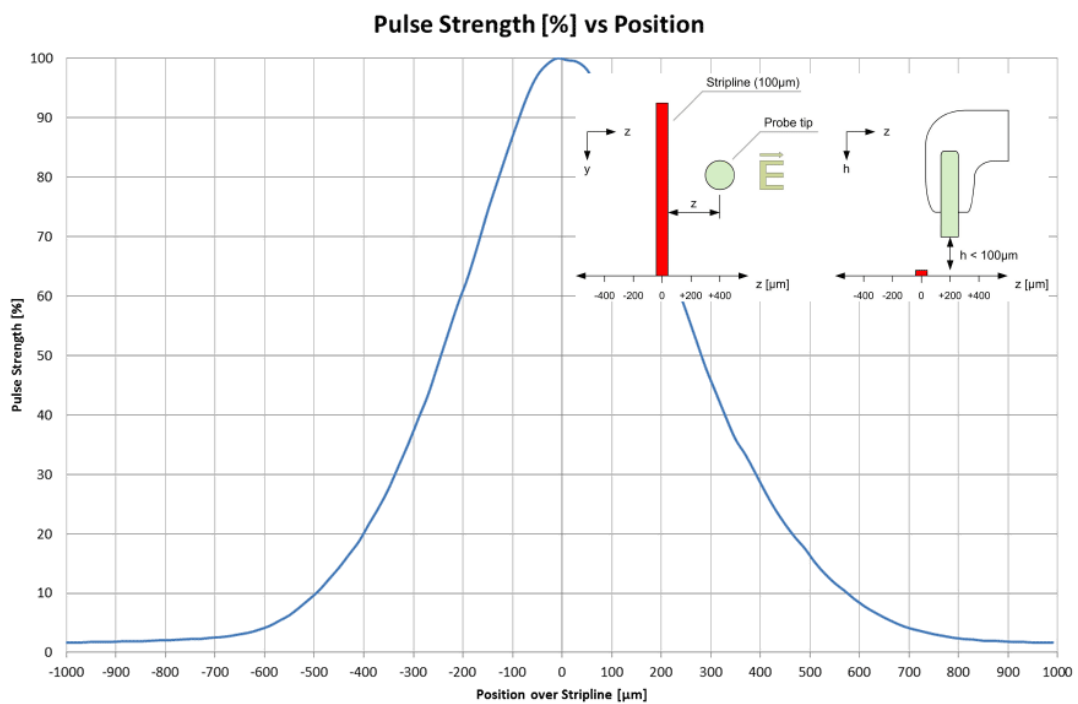
Technische Parameter

Maße Sondenkopf:	Ø 450 µm
Max. Verschiebungsstrom (Stripline 100 µm)	7 mA
Pulsparameter	
Anstiegszeit	< 2 ns
Wiederholfrequenz	0.1 Hz - 20 kHz
Polarität (Software gesteuert)	+ / - / alternating
Messausgang	50 Ω
Trigger Puls Verzögerung (Bypass Modus - Delay Line)	
min. Trigger Puls Verzögerung (typ.)	70 ns
max. Trigger Puls Verzögerung (typ.)	420 ns
max. Jitter (typ.)	± 1 ns
Versorgung	BPS 202
Gewicht	70 g
Maße (L x B x H)	(26 x 43 x 53) mm

Pulsform



Querscan



Puls E-Feldquelle ICI E450 L-EFT in Anwendung

